第三章 假设检验

一.关于总体的假设可以分为两大类

- (-)设总体X的分布 $F(x;\theta)$ 类型已知,其中参数 θ 未知,仅对未知 参数θ提出假设, 称这类假设为参数假设检验。
- (二)设总体X的分布未知, 只对未知分布函数类型或它的某些特 征提出假设, 称这类假设为非参数假设检验。

例1: 某油品公司的桶装润滑油标定重量为10Kg, 检验部门从市场上随机抽取10桶, 称得重量分别为10.2, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.9, 10.4, 10.2, 9.8, 假设每桶油实际重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma = 0.1$, 问该公司的桶装油的重量是否符合标准?

例2: 设从某书中抽查100页,记录各页中印刷错误的个数,能 否认为一页印刷错误的个数X服从泊松分布?

假设检验:依据从总体中取得的样本观测值来判断假设是否成立的一种程序.

原假设(零假设):根据检验结果准备予以拒绝或不予拒绝(予以接收)的假设,以Ho表示.

备择假设(对立假设):与原假设不相容的假设,以H1表示.

二.假设检验思想

- 1. 从具体问题出发,构造适当的统计量 $T(X_1,...,X_n)$,将样本 $(X_1,...,X_n)$ 中包含的有关信息集中在一起.
- 2. 检验:制定一判断规则,使根据样本观测值 $(x_1,...,x_n)$ 可做出是否拒绝原假设 H_0 的决定,每个这样的规则就是一种检验.

W: 拒绝域; \bar{W} : 接受域; 检验函数: 拒绝域W的示性函数.

$$\phi(x_1,...,x_n) = \begin{cases} 1, & (x_1,...,x_n) \in W \\ 0, & (x_1,...,x_n) \in \bar{W} \end{cases}$$

$$W = \{(x_1, ..., x_n) : \phi(x_1, ..., x_n) = 1, (x_1, ..., x_n) \in \chi\}$$

- 3. 给定统计量T后, 确定临界值c.
- (1) 原则:一次观测中小概率事件发生的可能性很小.

例: 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 其中 μ 为未知参数, 考虑假设检验问题:

$$H_0: \mu = 0, \quad H_1: \mu \neq 0.$$

抽取样本 $(X_1,...,X_{10})$, 令 $T = \bar{X}$ 作为检验统计量, 设由样本观测值可得 $\bar{x} = 0.8$, 判断是否拒绝 H_0 .

(2) 显著性水平:对每次检验,确定一个值 α ,当一事件发生的概率小于此 α 时,就认为是一个小概率事件,称此 α 为检验的显著性水平.

对上例,给定显著性水平 α , 在原假设成立的条件下, $\bar{X} \sim N(0, \frac{1}{n})$,

$$P(|\bar{X}| \ge c) = \alpha, \ P(\sqrt{n}\bar{X} \ge \sqrt{n}c) = \frac{\alpha}{2},$$

$$\therefore P(\sqrt{n}\bar{X} < \sqrt{n}c) = 1 - \frac{\alpha}{2}, \ \therefore c = \frac{u_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n}}$$

$$n = 10, \, \Re \alpha = 0.05, \Rightarrow c = 0.62,$$

当 $T(x_1,...,x_n) = X(x_1,...,x_n) \ge 0.62$ 时,拒绝原假设 H_0 . 注:接受原假设不是在逻辑上证明了原假设的正确,且由于样本的随机性,不意味着它一定是正确的假设.

三.两类错误

1.原假设 H_0 正确时,由于样本的随机性而落入了拒绝域,因而作出拒绝 H_0 的错误判断,称它犯了**第一类错误**,记犯第一类错误的概率为 α , (拒真错误)

$$P\{拒绝H_0|H_0正确\} = \alpha$$

2.对立假设 H_1 正确,由于样本的随机性而落入接受域,因此作出接受原假设 H_0 的错误判断,称它犯了**第二类错误**,记犯第二类错误的概率为 β ,(纳伪错误)

$$P$$
{接受 $H_0|H_1$ 正确} = β

注: 犯第一类错误概率的最大值就是检验的显著水平.

总体样本	H ₀ 正确	<i>H</i> ₁ 正确
接受H ₀	正确	第二类错误
拒绝H ₀	第一类错误	正确

3.只考虑控制犯第一类错误的概率 α ,而不考虑犯第二类错误的概率,这样的检验称为显著性水平为 α 的显著性检验.

- 4.显著性检验的一般步骤
- (1) 提出假设:根据问题的要求建立原假设H₀和对立假设H₁;
- (2) 选统计量:根据H₀的内容选取一个合适的检验统计量T,确定它的抽样分布,算出抽样分布的分位数;
- (3) 给定显著水平: α 的值一般取得较小,如0.05, 0.01, 0.10等;
- (4) 确定拒绝域:在原假设Ho正确的条件下,求出能使

$$P\{(X_1,\cdots,X_n)\in W|H_0\}\leq \alpha$$

成立的拒绝域W,拒绝域W与所选的统计量T和假设有关,常用检验统计量T和相应的临界值c表示.

(5) 对 H_0 作出推断: 比较检验统计量T的观测值t和相应的临界值c,看样本观测值是否落入拒绝域. 如果样本观测值 $(x_1, \dots, x_n) \in W$,则拒绝原假设 H_0 ,否则接受 H_0 .

一.数学期望的检验

- **1. U检验:** 设 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$, (X_1, \dots, X_n) 为取自总体的样本,其中 σ_0^2 已知,要检验

取 $U = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma_0} \sqrt{n}$ 为检验统计量,对给定的显著性水平 α ,为使

$$P\{(X_1,\cdots,X_n)\in W|H_0\}=\alpha,$$

应有

$$P\{u_1 < U < u_2 | H_0\} = 1 - \alpha.$$

由于 $U \sim N(0,1)$ 具有对称性,故可取

$$P\{|U|>u_{1-\frac{\alpha}{2}}|H_0\}=\alpha.$$

其中 u_{α} 是标准正态分布的 α 分位数.

因此得到检验的拒绝域为

$$W = \{(x_1, \dots, x_n) : |u| = \frac{|\overline{x} - \mu_0|}{\sigma_0} \sqrt{n} > u_{1 - \frac{\alpha}{2}}\}$$
$$= \{u < u_{\frac{\alpha}{2}} \not \leq u > u_{1 - \frac{\alpha}{2}}\}$$

计算U的观测值u,查表得到u_{1-α}。

 $|x| = |u| > u_{1-\alpha}$,则拒绝原假设 H_0 ,即认为总体的数学期望 μ 与 μ_0 之间 有显著差异:

否则, $\ddot{a}|u| \leq u_{1-\frac{\alpha}{2}}$, 则接受 H_0 , 即认为观测结果与原假设 H_0 无显 著差异.

(2) $H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ 取 $U = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma_0} \sqrt{n}$ 为检验统计量,对给定的显著性水平 α ,由

$$P\{U>u_{1-\alpha}|H_0\}=\alpha.$$

查表得临界点 $u_{1-\alpha}$, 故拒绝域为 $W = \{u > u_{1-\alpha}\}$,然后计算u, 若 $u > u_{1-\alpha}$,则拒绝 H_0 ,否则接受 H_0 .

(3) $H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$ 取 $U = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma_0} \sqrt{n}$ 为检验统计量,对给定的显著性水平 α ,由

$$P\{U < u_{\alpha}|H_0\} = \alpha.$$

查表得临界点 u_{α} ,故拒绝域为 $W = \{u < u_{\alpha}\}$,然后计算u,若 $u < u_{\alpha}$,则拒绝 H_0 ,否则接受 H_0 .

注:

- (a)这种检验为U检验;
- (b) (1)为双侧检验, (2),(3)为单侧检验

例1:全市高三学生毕业会考,数学成绩的平均分为70分,随机抽查10名男生的会考成绩如下,

65, 72, 89, 56, 79, 63, 92, 48, 75, 81,

若已知男生的会考成绩服从正态分布,且标准差为10分,问男生 的会考平均成绩是否为70分?(a = 0.05)

解:设 $H_0: \mu=70, H_1: \mu\neq 70$ 采用U检验,选取统计量 $U=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}$,当 H_0 成立时, $U\sim N(0,1)$ 对给定的显著性水平 α ,由 $P\{|U|>u_{0.975}|H_0\}=0.05,查表得<math>u_{1-\frac{\alpha}{2}}=u_{0.975}=1.96$ 所以拒绝域为 $W=\{|u|>1.96\}$,而 $|u|=\frac{|\overline{X}-\mu_0|}{\sigma_0}\sqrt{n}=\frac{|72-70|}{10}\sqrt{10}=0.63< u_{0.975}$ 所以接受 H_0 ,即在显著性水平0.05下可以认为男生的会考平均成绩为70分。

例1:全市高三学生毕业会考,数学成绩的平均分为70分,随机抽查10名男生的会考成绩如下,

65, 72, 89, 56, 79, 63, 92, 48, 75, 81,

若已知男生的会考成绩服从正态分布,且标准差为10分,问男生 的会考平均成绩是否为70分?(a = 0.05)

解: 设 $H_0: \mu = 70, H_1: \mu \neq 70$ 采用U检验,选取统计量 $U = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma_0} \sqrt{n}$, 当 H_0 成立时, $U \sim N(0,1)$ 对给定的显著性水平 α ,由 $P\{|U| > u_{0.975}|H_0\} = 0.05$,查表得 $u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0.975} = 1.96$ 所以拒绝域为 $W = \{|u| > 1.96\}$,而 $|u| = \frac{|\overline{X} - \mu_0|}{\sigma_0} \sqrt{n} = \frac{|72 - 70|}{10} \sqrt{10} = 0.63 < u_{0.975}$ 所以接受 H_0 ,即在显著性水平0.05下可以认为男生的会考平均成绩为70分。

(ロト 4团 M 4 분 M 4 분 M 9 9 9 9

例2: 某厂生产一种灯泡, 其寿命 $X \sim N(\mu, 200^2)$,从过去来看, 灯泡的平均寿命为1500h,现采用新工艺, 在所生产的灯泡中抽取25只, 测得平均寿命为1675h,问采用新工艺后, 灯泡寿命是否有显著提高? ($\alpha=0.05$)

解:设 $H_0: \mu=1500, H_1: \mu>1500$ 采用U检验,选取统计量 $U=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}$ 当 H_0 成立时, $U\sim N(0,1)$ 对给定的显著性水平 α ,拒绝域为 $W=\{u>u_{1-\alpha}\}$ 查表得 $u_{1-\alpha}=u_{0.95}=1.645$ 而 $u=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}=\frac{1675-1500}{200}\sqrt{25}=4.375>1.645$ 所以拒绝 H_0 ,认为灯泡寿命有显著提高。

例2: 某厂生产一种灯泡, 其寿命 $X \sim N(\mu, 200^2)$,从过去来看, 灯泡的平均寿命为1500h,现采用新工艺, 在所生产的灯泡中抽取25只, 测得平均寿命为1675h,问采用新工艺后, 灯泡寿命是否有显著提高? ($\alpha=0.05$)

解: 设 $H_0: \mu = 1500, H_1: \mu > 1500$ 采用U检验,选取统计量 $U = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma_0} \sqrt{n}$ 当 H_0 成立时, $U \sim N(0,1)$ 对给定的显著性水平 α ,拒绝域为 $W = \{u > u_{1-\alpha}\}$ 查表得 $u_{1-\alpha} = u_{0.95} = 1.645$ 而 $u = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma_0} \sqrt{n} = \frac{1675 - 1500}{200} \sqrt{25} = 4.375 > 1.645$ 所以拒绝 H_0 ,认为灯泡寿命有显著提高。

2. t检验: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, (X_1, \dots, X_n) 为取自总体的样本,其中 σ^2 未知,要检验 $(1)H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$

选取统计量 $T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \stackrel{H_0}{\sim} t(n-1)$ (用样本方差代替总体方差)

对给定的显著性水平 α , 由 $P\{|T|>t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)|H_0\}=\alpha$ 查表求出T的双侧分位点, 得拒绝域 $W=\{|t|>t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$, 若由样本观测值计算 $|t|>t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$, 则拒绝 H_0 , 否则接受 H_0 .

◆□▶ ◆圖▶ ◆圖▶ ◆圖▶ ■ 釣魚@

注:

- (1)这种检验称为双侧t检验.
- (2)单侧t检验

$$H_0: \mu = \mu_0, \ H_1: \mu > \mu_0$$
,拒绝域为 $W = \{t > t_{1-\alpha}(n-1)\}$
 $H_0: \mu = \mu_0, \ H_1: \mu < \mu_0$,拒绝域为 $W = \{t < t_{\alpha}(n-1)\}$

例3:某种钢筋强度X服从正态分布,且 $EX = 50(Kg/mm^2)$,今改 变炼钢配方利用新法炼了9炉钢、从这9炉钢中每炉抽一根、测得 强度分别为:

56.01, 52.45, 51.53, 48.52, 49.04, 53.38, 54.02, 52.13, 52.15, 问采用新法其钢筋强度均值是否有明显提高? ($\alpha = 0.05$)

解: 设 $H_0: \mu = 50, H_1: \mu > 50$

例3:某种钢筋强度X服从正态分布,且 $EX = 50(Kg/mm^2)$,今改 变炼钢配方利用新法炼了9炉钢、从这9炉钢中每炉抽一根、测得 强度分别为:

56.01, 52.45, 51.53, 48.52, 49.04, 53.38, 54.02, 52.13, 52.15, 问采用新法其钢筋强度均值是否有明显提高? ($\alpha = 0.05$)

解: 设 $H_0: \mu = 50, H_1: \mu > 50$ 总体方差未知, 选取统计量 $T = \frac{X - \mu_0}{c} \sqrt{n}$.

对显著性水平 $\alpha = 0.05$,查表得 $t_{0.95}(8) = 1.86$,因而拒绝域 为 $W = \{t > 1.86\},$

由样本得 $\bar{x} = 52.14, s = 2.24,$ 则 $t = \frac{52.14 - 50}{2.24} \sqrt{9} = 2.87 > 1.86$ 所以拒绝Ho.即认为强度有明显提高。

二.方差的检验

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, (X_1, \dots, X_n) 为取自总体的样本,要检验 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \longleftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

(1)若 $\mu = \mu_0$ 已知,当 H_0 成立时,选取统计量

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n)$$

故对给定的显著性水平 α ,由 $P(k_1 < \chi^2 < k_2) = 1 - \alpha$ 确定 k_1, k_2 ,得拒绝域

$$W = \{(x_1, \dots, x_n) : \chi^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n) \not \propto \chi^2 > \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)\}.$$

其中 $\chi^2_{\alpha}(n)$ 是 $\chi^2(n)$ 分布的 α 分位数.

(2)若 μ 未知,用 \overline{X} 代替 μ ,选取统计量

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

对给定的显著性水平 α ,拒绝域为

$$W = \{(x_1, \cdots, x_n) : \chi^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \not \preceq \chi^2 > \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}.$$

例4: 某种导线要求其电阻的标准差不得超过0.005Ω,今在生产的一批导线中取样品9根,测得S = 0.007Ω,问在 $\alpha = 0.05$ 下,能认为这批导线的方差显著偏大吗?

解: 设 $H_0: \sigma^2 = (0.005)^2 H_1: \sigma^2 > (0.005)^2$ μ 未知,取统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2(9-1)$ 由 $\alpha = 0.05$,查表得 $\chi^2_{0.95}(8) = 15.5$,所以拒绝域 $W = \{\chi^2 > 15.5\}$ 由样本 $\chi^2 = \frac{8*0.007^2}{0.005^2} = 15.68 > 15.5$,所以拒绝 H_0 ,认为这批导线方差显著偏大。

例4: 某种导线要求其电阻的标准差不得超过 0.005Ω .今在生产的 一批导线中取样品9根、测得 $S=0.007\Omega$.问在 $\alpha=0.05$ 下、能认 为这批导线的方差显著偏大吗?

解: 设 $H_0: \sigma^2 = (0.005)^2 H_1: \sigma^2 > (0.005)^2$ μ 未知,取统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2(9-1)$

由 $\alpha = 0.05$, 查表得 $\chi_{0.95}^2(8) = 15.5$, 所以拒绝域 $W = \{\chi^2 > 15.5\}$ 由样本 $\chi^2 = \frac{8*0.007^2}{0.0062} = 15.68 > 15.5$,所以拒绝 H_0 ,认为这批导线方 差显著偏大。

三.数学期望的比较

设 (X_1, \cdots, X_{n_1}) , (Y_1, \cdots, Y_{n_2}) 是分别取自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的两个简单随机样本,而且假设这两个样本之间也是相互独立的.分别用 \overline{X} , \overline{Y} , S_1^2 , S_2^2 表示这两个样本的均值和方差

$$\overline{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \qquad \overline{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} Y_j,$$

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \overline{X})^2, \qquad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \overline{Y})^2.$$

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \longleftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

(1)已知 σ_1^2 , σ_2^2 考虑 $\overline{X} - \overline{Y}$,由于给定二个样本之间的独立性,

$$E(\overline{X} - \overline{Y}) = \mu_1 - \mu_2,$$

$$D(\overline{X} - \overline{Y}) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}.$$

因此在原假设 H_0 ($\mu_1 = \mu_2$)成立时,统计量

$$U=rac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{rac{\sigma_1^2}{n_1}+rac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1).$$

否则,U服从均值不为零的正态分布.故对给定的显著性水平 α ,应取拒绝域 $W = \{|u| > u_{1-\frac{\alpha}{2}}\}.$

(2)
$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$$
 (方差未知但相等)

类似于前面t检验中的讨论,当总体方差未知时,应该用样本方差代替总体方差,而且由于给定二个总体的方差相等,我们用二个样本的合并方差 $S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$ 代替 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$. 由定理

$$\frac{\overline{X} - \overline{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

因此在原假设 H_0 ($\mu_1 = \mu_2$)成立时,统计量

$$T = \frac{X - Y}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

可作为 H_0 的检验统计量.对给定的显著水平 α ,取拒绝域 $W = \{ |t| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) \}$ 这就是两样本的t检验.

(3)
$$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$
, $n_1 = n_2 = n$ (方差未知且不等,但样本大小相等) 定义 $Z_i = X_i - Y_i$, $i = 1, \dots, n$, 显然, Z_i 相互独立.记

$$E(Z_i) = E(X_i - Y_i) = \mu_1 - \mu_2 = d,$$

 $D(Z_i) = DX_i + DY_i = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 = \sigma^2,$

则
$$Z_i \sim N(d, \sigma^2)$$
, $i = 1, \dots, n$. 因此,等价于检验假设

$$H_0: d=0 \longleftrightarrow H_1: d\neq 0$$

这里 σ^2 未知, 由t检验,记

$$\overline{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Z_i, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (Z_i - \overline{Z})^2,$$

则当 H_0 (d=0)成立时,有

$$T = \frac{\overline{Z}}{S}\sqrt{n} \sim t(n-1)$$

(4)
$$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$
, $n_1 \neq n_2$

不妨设m < m.令

$$Z_i = X_i - \sqrt{\frac{n_1}{n_2}}Y_i + \frac{1}{\sqrt{n_1 \cdot n_2}} \sum_{j=1}^{n_1} Y_j - \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} Y_j, \qquad i = 1, \dots, n_1,$$

则
$$E(Z_i) = \mu_1 - \sqrt{\frac{n_1}{n_2}}\mu_2 + \frac{1}{\sqrt{n_1 \cdot n_2}}n_1\mu_2 - \mu_2 = \mu_1 - \mu_2 = d,$$

$$D(Z_{i}) = E[(X_{i} - \mu_{1}) - \sqrt{\frac{n_{1}}{n_{2}}}(Y_{i} - \mu_{2}) + \frac{1}{\sqrt{n_{1}n_{2}}} \sum_{j=1}^{n_{1}} (Y_{j} - \mu_{2})$$

$$-\frac{1}{n_{2}} \sum_{j=1}^{n_{2}} (Y_{j} - \mu_{2})]^{2}$$

$$= \sigma_{1}^{2} + \frac{n_{1}}{n_{2}} \sigma_{2}^{2} + \sigma_{2}^{2} (\frac{n_{1}}{n_{1}n_{2}} + \frac{n_{2}}{n_{2}^{2}} - \frac{2}{n_{2}} + \frac{2\sqrt{n_{1}}}{n_{2}\sqrt{n_{2}}} - \frac{2n_{1}}{n_{2}\sqrt{n_{1}n_{2}}})$$

$$= \sigma_{1}^{2} + \frac{n_{1}}{n_{2}} \sigma_{2}^{2},$$

$$Cov(Z_{i}, Z_{j}) = 0, \qquad i \neq j, \ i, j = 1, \dots, n_{1}.$$

记
$$\sigma^2 = \sigma_1^2 + \frac{n_1}{n_2} \sigma_2^2$$
,则有 $Z_i \sim N(d, \sigma^2)$, $i = 1, \dots, n_1$,且各 Z_i 相互独立.因此等于检验假设

$$H_0: d=0 \longleftrightarrow H_1: d \neq 0,$$

这里
$$\sigma^2$$
未知, 选统计量 $T = \frac{\overline{Z}}{S} \sqrt{n_1} \stackrel{H_0}{\sim} t(n_1 - 1)$.



四. 方差的比较

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \longleftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

 $1. \mu_1, \mu_2$ 已知

$$S_1^{*2} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2, S_2^{*2} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \mu_2)^2$$

采用F检验,选统计量

$$F = \frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}} \stackrel{H_0}{\sim} F(n_1, n_2).$$

故对给定的显著性水平 α ,可取拒绝域

$$W = \{F < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2) \not \leq F > F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)\}$$

2. μ1, μ2未知

记
$$S_1^2 = \frac{1}{n_1-1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{n_2-1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$$
采用F检验、选统计量

$$F = rac{S_1^2}{S_2^2} \stackrel{H_0}{\sim} F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

故对给定的显著性水平 α .可取拒绝域

$$W = \{F < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) \not \propto F > F_{1 - \frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)\}$$

注:
$$F_{\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$$

一.区间估计的基本概念

1.定义: 设总体分布族为 $\{F(x,\theta): \theta \in \Theta\}$, 从中抽取样 本 $(X_1,...,X_n)$, 若 $\hat{\theta}_i = \hat{\theta}_i(X_1,...,X_n)$, i = 1,2是定义在样本空间上, 而在参数空间 Θ 上取值的两个统计量, 且 $\hat{\theta}_1 \leq \hat{\theta}_2$, 则 称 $[\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2]$ 为 θ 的一个区间估计. 如果对给定的 α (0 < α < 1), 有

$$P_{\theta}(\hat{\theta}_1 \le \theta \le \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta,$$
 (1)

则称 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间, $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 分别称为双侧置信上、下限.

2.定义: 若 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, ..., X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, ..., X_n)$ 是定义在样本空间上, 而在参数空间 Θ 上取值的两个统计量, 如果对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$, 分别有

$$P_{\theta}(\hat{\theta}_1 \leq \theta) = 1 - \alpha, \quad P_{\theta}(\hat{\theta}_2 \geq \theta) = 1 - \alpha, \forall \theta \in \Theta,$$

则分别称 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的(单侧)置信下限和(单侧)置信上限.

- **3.定理:** 设 $\hat{\theta}_1$, $\hat{\theta}_2$ 分别是 θ 的置信水平为 $1-\alpha_1$ 和 $1-\alpha_2$ 的(单侧)置 信下限和(单侧)置信上限, 且 $\hat{\theta}_1 < \hat{\theta}_2$. 若总体分布是连续型的, 则 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 是 θ 的置信水平为 $1 - (\alpha_1 + \alpha_2)$ 的双侧置信区间.
- 4.定义(多维参数的置信域):设有一参数分布 族 $\{F(x,\theta):\theta\in\Theta\},\theta=(\theta_1,...,\theta_k)\in\Theta\subset R^k,(X_1,...,X_n)$ 是取自 这个总体的一个样本, 若 $S(X_1,...,X_n)$ 满足:
- (1)对 \forall ($x_1,...,x_n$), $S(x_1,...,x_n)$ 是 θ 的一个子集,
- (2)对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$.

$$P_{\theta}(\theta \in S(X_1,...,X_n)) = 1 - \alpha, \forall \theta \in \Theta,$$

则称 $S(X_1,...,X_n)$ 是 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信域.

二.构造置信区间

直接法

- (1) 寻找 $(X_1,...,X_n)$ 和 θ 的函数 $G = G(X_1,...,X_n,\theta)$ s.t. $F_G(x)$ 已知;
- (2) 给定置信水平 $1-\alpha$, 确定 F_G 的分位数c,d, s.t.

$$P_{\theta}(c \leq G \leq d) = F_{G}(d) - F_{G}(c - 0) = 1 - \alpha;$$

(3)
$$c \leq G \leq d \Rightarrow \hat{\theta}_1(X_1, ..., X_n) \leq \theta \leq \hat{\theta}_2(X_1, ..., X_n)$$
$$P_{\theta}(\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha,$$

 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 是 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

第三节 区间估计

例1: 设($X_1,...,X_n$)是来自 $U(0,\theta)$ 的一个样本, 对给定的 $\alpha(0 < \alpha < 1)$, 求 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

例2: 设($X_1,...,X_n$)是取自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本, μ,σ^2 未知, 分别求 μ,σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

例3: 设某产品的寿命X服从指数分布,

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \lambda > 0,$$

因 $EX = 1/\lambda$ 表示平均寿命, 只要求该产品平均寿命的下限, 即 λ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信上限.